



## Fundamentos de la microscopía electrónica de barrido y microanálisis elemental.

Curso de postgrado de la Facultad de Ciencias Exactas UNLP Fecha: 18 al 22 de septiembre de 2017 (45hs) Lugar: Y-TEC.

Modalidad: teórico práctico con evaluación.

Costo: gratis para alumnos del doctorado, 5000 ARS para empresas.

Cupo: máximo 20 asistentes.

Fecha de inscripción: del 4 al 12 de septiembre.

Inscripciones: el postulante deberá enviar completo el formulario adjunto a la siguiente dirección: mariano.cipollone@ypftecnologia.com

**Descripción y objetivos:** En el curso se trataran los fundamentos de la microscopía electrónica de barrido y el microanálisis elemental. El objetivo del curso está centrado en los fundamentos de estas técnicas para que los asistentes entiendan los alcances y aplicaciones de las mismas.

## Temas a tratar:

## Microscopía Electrónica de Barrido

Interacción de un haz de electrones con una muestra sólida Física de la emisión electrónica.

Distintos tipos de contrastes (potencial, corriente absorbida, magnético y EBSD) Tecnología de un SEM, cañones de electrones, lentes, detectores

## Microanálisis elemental con sonda de electrones

Física de la emisión de rayos-X de una muestra bombardeada con electrones. Absorción de rayos-X, función  $\phi(\rho,z)$ , método ZAF, detectores EDS de Si(Li), SDD y WDS.